Physique des Matériaux II

Filière : SMP - Semestre : VI

Travaux Dirigés Série n°2

2024/2025

On considère la fonction $f_{FD}(E)$ comme étant la fonction de distribution des électrons dans un semi conducteur ;

- 1. Rappeler l'expression de cette fonction de distribution ;
- 2. En déduire l'expression de la fonction de distribution des trous ;
- 3. Dans l'approximation de la statistique de Maxwell Boltzmann donner les fonctions équivalentes aux distributions des électrons et des trous ;
- **4.** On considère le semi-conducteur non dégénéré ; établir les expressions des concentrations des porteurs de charge.

$$I(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha} \cdot e^{-x} \cdot dx = \alpha \sqrt{\pi}$$

1. Expression de la fonction de distribution des électrons f_n

$$f_n(E) = f_{FD}(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1}$$

2. Expression de la fonction de distribution des trous f_p

$$f_p(E) = 1 - f_{FD}(E) = 1 - \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1}$$

$$f_p(E) = \frac{1}{e^{\frac{E_F - E}{k_B T}} + 1}$$

3. Approximation de M.B.

La distribution statistique de Fermi-Dirac peut être simplifiée de la façon suivante

$$f_D(E) \approx e^{-\frac{E - E_F}{k_B T}} = f_{MB}(E)$$

$$f_n(E) \approx e^{-\frac{E - E_F}{k_B T}}$$

$$f_p(E) \approx e^{\frac{E - E_F}{k_B T}}$$

4. Expressions des concentrations des porteurs de charge dans un semiconducteur non dégénéré

Concentrations des électrons

$$n = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_{E_C}^{\infty} \sqrt{E - E_C} \cdot e^{-\frac{E - E_F}{k_B T}} dE$$

On pose

$$x = \beta(E - E_C) dx = \beta dE$$

$$n = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e}{\hbar^2}\right)^{3/2} \frac{e^{-\beta(E_C - E_F)}}{\beta^{3/2}} \int_0^\infty \sqrt{x} \, e^{-x} dx$$

$$I(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha} \cdot e^{-x} \cdot dx = \alpha \sqrt{\pi}$$

$$n = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e \cdot k_B T}{\hbar^2} \right)^{3/2} \cdot e^{-\beta (E_C - E_F)} \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$n = 2\left(\frac{2\pi m_e. k_B T}{h^2}\right)^{3/2}.e^{-\beta(E_C - E_F)}$$

Concentrations des trous

$$p = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_t}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_{-\infty}^{E_V} \sqrt{E_V - E} \cdot e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} dE$$

On pose

$$y = \beta(E_V - E) dy = -\beta dE$$

$$p = -\frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_t}{\hbar^2}\right)^{3/2} \frac{1}{\beta^{3/2}} \int_{+\infty}^0 \sqrt{y} \cdot e^{-y} \cdot e^{\beta(E_V - E_F)} dE$$

$$p = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_t k_B T}{\hbar^2} \right)^{3/2} e^{\beta (E_V - E_F)} \int_0^{+\infty} \sqrt{x} . e^{-x} dE$$

$$p = 2\left(\frac{2\pi m_t \cdot k_B T}{h^2}\right)^{3/2} e^{\beta(E_V - E_F)}$$

Concentrations intrinsèque

$$n = p = n_i \qquad \qquad n_i^2 = n. \, p$$

$$n_i^2 = 4 \left(\frac{2\pi . k_B T}{h^2} \right)^3 (m_e. m_t)^{3/2} . e^{-\beta (E_C - E_V)}$$

$$n_i = 2\left(\frac{2\pi . k_B T}{h^2}\right)^{3/2} (m_e. m_t)^{3/4}. e^{-\beta \frac{E_g}{2}}$$

Soit un cristal semi-conducteur intrinsèque (Ge) à T = 300K;

- 1. Déterminer la position du niveau de Fermi intrinsèque d'un tel cristal ;
- 2. Calculer la concentration intrinsèque ;
- 3. Combien d'atomes de Ge donnent naissance à une paire électron/trou?

 $m_e = m_t = 0.5 m_0$

On donne:

$$M_{Ge} = 72,59g$$

$$\rho$$
=5,33g/cm³ Eg=0,66eV

1. Position du niveau de Fermi intrinsèque du cristal de Ge

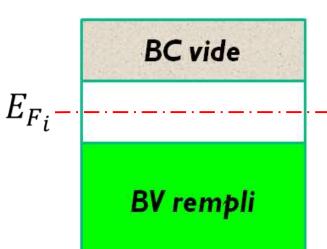
Il s'agit d'un SC intrinsèque :

$$E_{F_i} = \frac{E_C + E_V}{2}$$

$$E_C = E_g + E_V$$
 ou

$$E_{F_i} = E_V + \frac{E_g}{2}$$

$$E_V = E_C - E_g \qquad \qquad E_{F_i} = E_C - \frac{E_g}{2}$$



2. Concentration intrinsèque

$$n_i = 2\left(\frac{2\pi . k_B T}{h^2}\right)^{3/2} (m_e. m_t)^{3/4}. e^{-\beta \frac{E_g}{2}}$$

$$k_B = 1,380649 \cdot 10^{-23} \text{ j/K}$$

 $h=6,626 \cdot 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ kg} / \text{s}$

$$n_i = 2,53.10^{19} m^{-3}$$

3. Création de paire électrons/trous

La concentration intrinsèque donne le nombre d'électrons ou de trous par unité de volume

$$n = p = n_i$$

La concentration atomique du germanium est donnée par l'expression suivante :

$$n_a = \frac{\rho \cdot N_{av}}{M}$$
 $n_a = 4.42 \cdot 10^{22} cm^3$

Soit N_0 le nombre d'atomes ionisés du Ge

(Atomes ionisés : atomes qui donnent naissance à une paire électrons/trous)

$$N_0 = n_i.V$$
 $N_{at} = n_{at}.V$
$$\frac{N_0}{N_{at}} = \frac{n_i}{n_{at}} = 6.10^{-10}$$

On considère un semi-conducteur intrinsèque dont les concentrations équivalentes d'états énergétiques dans les bandes de valence et de conduction sont notées n_V et **n**_c.

- 1. Rappeler les expressions des concentrations des porteurs de charges (n et p);
- En déduire l'expression de la concentration intrinsèque n_i ainsi que la position du niveau de Fermi E_{Fi} ;
- Le semi-conducteur en question est du silicium ; calculer la concentration intrinsèque et la position du niveau de Fermi aux différentes températures : 27°C, 127°C, 227°C.

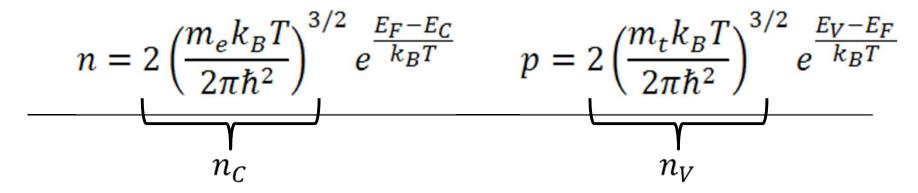
$$Eg = 1,1 eV$$

$$n_C = 2.7 \ 10^{19} \ cm^{-3}$$

$$n_C = 2.7 \ 10^{19} \ cm^{-3}$$
 $n_V = 1.1 \ 10^{19} \ cm^{-3}$

$$k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ j/K}$$

1. Concentrations des porteurs de charges (*n* et *p*)



2. Concentration intrinsèque *n_i*

$$n = p = n_i \qquad n_i^2 = n.p$$

$$n_i^2 = n_C. n_V. e^{-\frac{E_{C-E_V}}{k_B T}} \qquad n_i^2 = n_C. n_V. e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$$

$$n_i = \sqrt{n_C n_V}. e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

Position du niveau de Fermi E_{Fi}

$$n = p$$
 $\frac{n}{p} = 1$ $\frac{n_C}{n_V} e^{\frac{E_{Fi} - E_C}{k_B T}} . e^{\frac{E_F - E_V}{k_B T}} = 1$ $\frac{n_C}{n_V} e^{\frac{2E_{Fi} - E_C - E_V}{k_B T}} = 1$

$$E_{F_i} = \frac{E_C + E_V}{2} + \frac{1}{2} k_B T ln \left(\frac{n_V}{n_C}\right)$$

3. Concentration intrinsèque et position du niveau de Fermi aux différentes températures : 27°C, 127°C, 227°C : cas du Si

$$n_{i} = \sqrt{n_{C}n_{V}} \cdot e^{-\frac{E_{g}}{2k_{B}T}} \qquad E_{F_{i}} = \frac{E_{g}}{2} + \frac{1}{2}k_{B}T \ln\left(\frac{n_{V}}{n_{C}}\right)$$

$$\sqrt{n_{C}n_{V}} = 1,723.10^{19} \qquad \frac{n_{V}}{n_{C}} = 0,407 \qquad \frac{1}{2}\ln\left(\frac{n_{V}}{n_{C}}\right) = -0,449$$

T(K)	300	400	500
k _B .T (eV)	0,026	0,0345	0,043
n _i	$1,12.10^{10}$	$2,05.10^{12}$	4,8.10 ¹³
E _{Fi}	0,538	0,534	0,53

On considère trois semi-conducteur dont les caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous :

	Eg (eV)	n _c (at/cm³)	n _v (at/cm³)
AsGa	1,43	4,7. 10 ¹⁷	7.10 ¹⁸
Ge	0,66	1,04. 10 ¹⁹	6.10 ¹⁸
Si	1,1	2,7.10 ¹⁹	1,10.10 ¹⁹

- 1. Parmi ces trois matériaux, quel est celui qui présente la concentration intrinsèque la plus faible ?
- 2. Calculer cette concentration intrinsèque pour le matériau choisi à T = 300K.

1. Plus faible concentration intrinsèque n_i

$$n_i = \sqrt{n_C n_V}. e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

La concentration intrinsèque n_i est proportionnelle à $\sqrt{n_c.n_V}$

	n _c n _V	$\sqrt{n_C n_V}$
AsGa	3,29.10 ³⁶	1,8. 10 ¹⁸
Ge	6,24.10 ³⁷	7,9. 10 ¹⁸
Si	2,97.10 ³⁸	16,3.10 ¹⁸

Il s'agit de l'AsGa

2. Concentration intrinsèque n_i (AsGa)

	n _c n _V	$\sqrt{n_C n_V}$	$e^{-rac{E_g}{2k_BT}}$	n _i (cm ⁻³)
AsGa	3,29.10 ³⁶	1,8.10 ¹⁸	9,98.10 ⁻¹³	1,8.106

Dans un matériau semi-conducteur la concentration intrinsèque est donnée par la relation

$$n_i = A. \exp\left(-\frac{\Delta E}{2k_B T}\right)$$

- 1. Que représente la constante $\Delta \mathbf{E}$?
- 2. Calculer la valeur de A pour les matériaux Ge et Si;
- 3. En déduire les valeurs des concentrations intrinsèques correspondantes à T=300K;
- 4. Quelles sont les fractions d'atomes ionisés dans chaque cas.

On donne:

$$M_{Si}$$
=28g

$$\rho$$
=2,33g/cm³

Constante **△E**

$$n_i = A. exp\left(-\frac{\Delta E}{2k_B T}\right)$$
 $n_i = \sqrt{n_C n_V}. e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$

La constante **\Delta E** représente le Gap du matériau

Valeurs de A et concentrations intrinsèques pour les matériaux Ge et Si

	$\sqrt{n_C n_V}$	$exp\left(-\frac{Eg}{2k_BT}\right)$	n _i (cm ⁻³)
Ge	7,899.10 ¹⁸	2,89. 10 ⁻⁶	2,284.10 ¹³
Si	1,723.10 ¹⁹	5,869. 10 ⁻¹⁰	1,011.10 ¹⁰

Fractions d'atomes ionisés dans chaque cas

	n _a (at/cm³)	n _i (cm ⁻³)	n _i / <i>Na</i>
Ge	4,42. 10 ²²	2,284.10 ¹³	5.10 ⁻¹⁰
Si	5,009. 10 ²²	1,011.10 ¹⁰	2. 10 ⁻¹³

On considère un barreau de silicium de longueur $L=5 \ mm$ et de section $S=1 \ mm^2$, fortement dopé par du phosphore dont la concentration est $N_d=2x10^{14} \ cm^{-3}$.

- 1. Quelle est la nature du dopage de ce semi conducteur ?
- 2. Calculer la concentration en trous et électrons ;
- 3. Calculer la résistivité. Comparer cette valeur à celle du métal cuivre ;
- 4. Calculer la valeur du courant qui circule dans ce barreau lorsque l'on applique une d.d.p de 5V à ses extrémités.

On donne:

Silicium:
$$\mu_n = 1.5 \cdot 10^3 cm^2/Vs$$
 $\mu_p = 5.3 \cdot 10^2 cm^2/Vs$ $n_i = 1.1 \cdot 10^{16} m^{-3}$

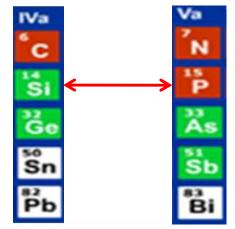
Cuivre:
$$n = 11.10^{28} m^{-3}$$
 $\mu_e = 3.2.10^{-3} m^2/Vs$

1. Nature du dopage du semi conducteur?

Il s'agit d'un barreau de silicium fortement dopé par du phosphore.

Le phosphore est un élément de la Vème colonne dans le tableau périodique.

Dopage par un élément de type V



Introduction d'une concentration N_d d'atomes donneurs

Le dopage est du type N

2. Concentration en trous et électrons

Loi d'action de masse

$$n.p = n_i^2$$

Il s'agit d'un dopage N

Neutralité électrique

$$n + N_a = p + N_d$$

$$N_a = 0$$

$$n - N_d = p$$

$$n.\left(n-N_d\right)=n_i^2$$

$$n^2 - n. N_d - n_i^2 = 0$$

$$n = \frac{1}{2} \left\{ (N_d - N_a) + \sqrt{(N_d - N_a)^2 + 4n_i^2} \right\} \quad p = -\frac{1}{2} \left\{ (N_d - N_a) - \sqrt{(N_d - N_a)^2 + 4n_i^2} \right\}$$

$$n = \frac{N_d}{2} \left\{ 1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_d^2}} \right\}$$

$$p = \frac{N_d}{2} \left\{ 1 - \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_d^2}} \right\}$$

 $N_d \gg n_i$

$$n \approx N_d$$

$$p \approx \frac{n_i^2}{N_d}$$

Application numérique

$$n \approx 2.10^{14} cm^{-3}$$

$$p \approx 0,55.10^6 cm^{-3}$$

Résistivité du Si et Comparaison le métal cuivre

$$\sigma = ne\mu_{\bar{e}} + pe\mu_t$$

$$\rho = \frac{1}{c}$$

$$\rho = \frac{1}{n. e. \mu_{\bar{e}} + p. e. \mu_{t}}$$

$$\approx 0$$

$$ho=0$$
,21 Ωm

Cu

$$\rho = 1,78.10^{-8}\Omega m$$

$$\rho_{Cu} \ll \rho_{Si}$$

4. Valeur du courant qui circule dans le barreau

Résistance du barreau

Resistance du barreau
$$R = \rho \frac{L}{S}$$
 $R = 1,05 \ K\Omega$ $I = \frac{U}{R}$ $I = 4,78 \ mA$

$$R = 1.05 K\Omega$$

$$I = \frac{U}{R}$$

$$t = 4,78 mA$$

